

NMC が制定に関与した規格の番号と名称

(1) JIS (99 規格、○：英訳有) []内は NMC が制定に関与した対応国際規格

【形状記憶合金】(7 規格)

- H 7001 形状記憶合金用語 (H1(1989)制定, H21(2009)改正)
- H 7101 形状記憶合金の変態点測定方法 (H1(1989)制定, H14(2002)改正)
- H 7103 Ti-Ni 形状記憶合金の引張試験方法 (H3(1991)制定, H24(2012)改正)
- H 7104 形状記憶合金コイルばねの定温荷重試験方法 (H5(1993)制定, H14(2002)改正, H24(2012)H7105 に統合)
- H 7105 Ti-Ni 形状記憶合金コイルばねの定ひずみ試験方法 (H5(1993)制定, H24(2012)改正)
- H 7106 形状記憶合金コイルばねの定ひずみ熱サイクル試験方法 (H5(1993)制定, H14(2002)改正)
- H 7107 Ti-Ni 形状記憶合金線, 条及び管 (H15(2003)制定, H21(2009)改正)

【水素吸蔵合金】(6 規格)

- H 7003 水素吸蔵合金用語 (H1(1989)制定, H19(2007)改正)
- H 7201 水素吸蔵合金の圧力—組成等温線 (PCT 線) の測定方法 (H3(1991)制定, H19(2007)改正)
- H 7202 水素吸蔵合金の水素化及び脱水素化反応速度測定方法 (H5(1993)制定, H19(2007)改正)
- H 7203 水素吸蔵合金の水素吸蔵・放出サイクル特性の測定方法 (H7(1995)制定, H19(2007)改正)
- H 7204 水素吸蔵合金の水素化熱測定方法 (H7(1995)制定)
- H 7205 ニッケル・水素蓄電池用水素吸蔵合金の放電容量試験方法 (H15(2003)制定)

【耐熱金属材料】(13 規格)

- Z 2278 金属材料の熱疲労試験方法 (H4(1992)制定)
- Z 2279 金属材料の高温低サイクル疲労試験方法 (H4(1992)制定)
- Z 2280 金属材料の高温ヤング率試験方法 (H5(1993)制定)
- Z 2281 金属材料の高温連続酸化試験方法 (H5(1993)制定)
- Z 2282 金属材料の高温繰返し酸化試験方法 (H8(1996)制定)
- Z 2285 金属材料の線膨張係数の測定方法 (H15(2003)制定)
- Z 2286 金属材料の高温回転曲げ疲労試験方法 (H15(2003)制定, R6(2024)Z 2274 に統合)
- Z 2287 ボイラ管用金属材料の水蒸気酸化試験方法 (H15(2003)制定)
- Z 2290 金属材料の高温腐食試験方法通則 (H16(2004)制定)
- Z 2291 金属材料の高温ガス腐食試験方法 (H16(2004)制定)
- Z 2292 金属材料の塩塗布高温腐食試験方法 (H16(2004)制定)
- Z 2293 金属材料の塩浸せき及び塩埋没高温腐食試験方法 (H16(2004)制定)
- Z 2294 金属材料の電気化学的高温腐食試験方法 (H16(2004)制定)

【金属基複合材料】(9 規格)

- H 7006 金属基複合材料用語 (H3(1991)制定)
- H 7401 金属基複合材料の繊維体積含有率試験方法 (H5(1993)制定)
- H 7402 繊維強化金属中の短繊維のアスペクト比試験方法 (H5(1993)制定)
- H 7403 繊維強化金属の繊維配向度試験方法 (H5(1993)制定)
- H 7404 繊維強化金属の線膨張係数の試験方法 (H5(1993)制定)
- H 7405 繊維強化金属の引張試験方法 (H5(1993)制定)
- H 7406 繊維強化金属の曲げ試験方法 (H5(1993)制定)
- H 7407 繊維強化金属の圧縮試験方法 (H7(1995)制定)
- H 7408 繊維強化金属の疲れ試験方法 (H6(1994)制定)

【金属の熱物性】(1 規格)

- H 7801 金属のレーザフラッシュ法による熱拡散率の測定方法 (H17(2005)制定)

【超塑性材料】(6 規格)

- H 7007 金属系超塑性材料用語 (H7(1995)制定, H14(2002)改正)
- H 7501 金属系超塑性材料の引張特性評価方法 (H14(2002)制定, H28(2016)改正) [ISO 20032: 2007 制定, 2013 改正]
- H 7502 金属系超塑性材料の圧縮特性評価方法 (H15(2003)制定)
- H 7503 金属系超塑性材料の成形後の空洞率測定方法 (H15(2003)制定)
- H 7504 金属系超塑性材料のバルジ試験によるブロー成形性試験・評価方法 (H15(2003)制定)
- H 7505 金属系超塑性材料の R 型試験片による引張特性評価方法 (H16(2004)制定, H28(2016) H7501 に統合)

【極低温材料】(3 規格)

- Z 2277 金属材料の液体ヘリウム中の引張試験方法 (H2(1990)制定)
- Z 2283 金属材料の液体ヘリウム中の低サイクル疲労試験方法 (H10(1998)制定)
- Z 2284 金属材料の液体ヘリウム中弾塑性破壊じん(靱)性 JIC 試験方法 (H10(1998)制定)

【金属触媒材料・超微粒子】(7 規格)

- H 7008 金属超微粒子用語 (H14(2002)制定)
- H 7802 示差熱分析法による金属超微粒子の発火温度測定方法 (H17(2005)制定)
- H 7803 金属触媒の粒子径及び結晶子径測定方法通則 (H17(2005)制定)
- H 7804 電子顕微鏡による金属触媒の粒子径測定方法 (H17(2005)制定)
- H 7805 X 線回折法による金属触媒の結晶子径測定方法 (H17(2005)制定)
- Z 8819-1 粒子径測定結果の表現—第 1 部: 図示方法 (H11(1999)制定)
- Z 8819-2 粒子径測定結果の表現—第 2 部: 粒子径分布からの平均粒子径及びモーメントの計算 (H13(2001)制定)

【生物忌避材料】(1 規格)

- H 7901 海洋生物忌避材料用語 (H17(2005)制定)

【硬さ試験方法】(2 規格)

- Z 2252 高温ビッカース硬さ試験方法 (H3(1991)制定)
- Z 2255 超微小負荷硬さ試験方法 (H15(2003)制定, H31(2019)修正)

【金属間化合物】(2 規格)

- H 7601-1 金属間化合物の引張試験方法—第 1 部：室温引張試験 (H14(2002)制定)
- H 7601-2 金属間化合物の引張試験方法—第 2 部：高温引張試験 (H14(2002)制定)

【輸送機器用軽量化板材 (高強度アルミニウム合金・高張力鋼)】(3 規格)

- H 7701 自動車用高強度アルミニウム合金板材のヘミング試験方法 (H15(2003)制定, H20(2008)改正)
- H 7702 自動車用アルミニウム合金板の引張曲げによるスプリングバック評価試験方法 (H15(2003)制定) [ISO 24213: 2008 制定, 2017 改正]
- Z 2257 十字形試験片を用いる金属板材の二軸引張試験方法 (R3(2021)制定) [ISO 16842: 2014 制定, 2021 改正]

【マグネシウム】(1 規格)

- H 0541 マグネシウム及びマグネシウム合金のアルカリ性塩水腐食試験方法 (H15(2003)制定)

【アモルファス金属】(4 規格)

- H 7004 アモルファス金属用語 (H2(1990)制定)
- H 7151 アモルファス金属の結晶化温度測定方法 (H3(1991)制定)
- H 7152 アモルファス金属単板磁気特性試験方法 (H3(1991)制定, H8(1996)改正)
- H 7153 アモルファス金属磁心の高周波磁心損失試験方法 (H3(1991)制定)

【金属系超電導材料】(5 規格)

- H 7005 超電導関連用語 (H3(1991)制定, H11(1999)改正)
 - H 7301 超電導—第 1 部：臨界電流の試験方法—ニオブ・チタン合金複合超電導線 (H9(1997)制定) [IEC 61788-1:1998 制定, 2006 改正]
 - H 7302 超電導—第 2 部：臨界電流の試験方法—ニオブ 3 すず複合超電導線 (H12(2000)制定) [IEC 61788-2:1999 制定, 2006 改正]
 - H 7306 超電導—残留抵抗比試験方法—ニオブ・チタン及びニオブ 3 すず複合超電導線の残留抵抗比 (H17(2005)制定) [IEC 61788-4:2001 制定, 2011 改正]
 - H 7308 超電導—超電導体に対するマトリックス体積比試験方法—ニオブ 3 すず複合超電導線の非銅部に対する銅部体積比 (H18(2006)制定) [IEC 61788-12:2002 制定, 2013 改正]

【原子力用材料(放射性廃棄物貯蔵材料)】(2 規格)

- G 5504 低温用厚肉フェライト球状黒鉛鋳鉄品 (H4(1992)制定, H17(2005)改正)
- G 5511 鉄系低熱膨張鋳造品 (H3(1991)制定)

【クラッド材料】(1 規格)

○Z 2288 薄板クラッド鋼の引張せん断試験方法及び曲げ試験方法 (H15(2003)制定)

【制振材料】(2 規格)

○H 7002 制振材料用語 (H1(1989)制定)

○G 0602 制振鋼板の振動減衰特性試験方法 (H5(1993)制定)

【ガスタービン用遮熱コーティング／傾斜機能材料】(7 規格)

○H 7851 遮熱コーティングの温度傾斜場での熱サイクル試験方法 (H17(2005)制定, H27(2015)改正) [ISO 13123: 2011 制定]

○H 8451 遮熱コーティングの熱サイクル試験方法及び熱衝撃試験方法 (H20(2008)制定, R3(2021)改正) [ISO 14188: 2012 制定]

○H 8452 耐酸化金属コーティングの耐はく離性試験方法 (H20(2008)制定)

○H 8453 遮熱コーティングの熱伝導率測定方法 (H22(2010)制定, H30(2018)改正) [ISO 18555: 2016 制定]

H 8454 遮熱コーティングの 4 点曲げによるヤング率測定方法 (H22(2010)制定, H30(2018)改正) [ISO 19477: 2016 制定]

H 8455 遮熱コーティングの線膨張係数測定方法 (H22(2010)制定, R4(2022)改正) [ISO 22680: 2020 制定]

H 8456 遮熱コーティングの高温熱伝導率測定方法 (R7(2025)制定) [ISO 24449: 2021 制定]

【表面化学分析】(11 規格)

K 0141 表面化学分析—データ転送フォーマット (H12(2000)制定)

K 0142 表面化学分析—情報フォーマット (H12(2000)制定) [ISO 14975: 2000 制定]

K 0143 表面化学分析—二次イオン質量分析法—シリコン中に均一に添加されたボロンの原子濃度の定量方法 (H12(2000)制定) [ISO 14237: 2000 制定, 2010 改正]

K 0144 表面化学分析—グロー放電発光分光分析方法通則 (H13(2001)制定) [ISO 14707: 2000 制定, 2015 改正]

K 0145 表面化学分析—X線光電子分光装置—エネルギー軸目盛の校正 (H14(2002)制定)

K 0146 表面化学分析—スパッター深さ方向分析—層構造系標準物質を用いた最適化法 (H14(2002)制定) [ISO 14606: 2000 制定]

K 0147-1 表面化学分析—用語—第 1 部: 一般用語及び分光法に関する用語 (H16(2004) K0147 制定, H29 (2017) K 0147-1, K 0147-2 に分割)

K 0147-2 表面化学分析—用語—第 2 部: 走査型プローブ顕微鏡に関する用語 (H16(2004) K0147 制定, H29 (2017) K 0147-1, K 0147-2 に分割)

○K 0148 表面化学分析—全反射蛍光 X 線分析法 (TXRF) によるシリコンウェーハ表面汚染元素の定量方法 (H17(2005)制定) [ISO 14706: 2000 制定, 2014 改正]

K 0149-1 マイクロビーム分析—走査電子顕微法—第 1 部: 像倍率校正方法 (H20(2008)制定) [ISO 16700: 2004 制定]

K 0150 表面化学分析—亜鉛及び／又はアルミニウム基金属めっきのグロー放電発光分光分析方法 (H21(2009)制定)

【ポーラス金属】（4 規格）

H 7009 ポーラス金属用語（H20(2008)制定, H28(2016)改正）

H 7902 ポーラス金属の圧縮試験方法（H20(2008)制定, H28(2016)改正）[ISO 13314: 2011 制定]

H 7903 ポーラス金属の熱伝導率試験方法（H20(2008)制定）

H 7904 ポーラス金属の高速圧縮試験方法（H24(2012)制定）[ISO 17340: 2014 制定, 2020 改正]

【磁性材料】（1 規格）

C 2500 超電導磁石を用いる開磁路法による永久磁石の磁気特性測定方法（R4(2022)制定）
[IEC/TR 63304: 2021 制定]

【規格様式】（1 規格）

Z 8301 規格票の様式及び作成方法（H20(2008)改正）

(2) ISO/IEC (44 規格) []内は NMC が制定に関与した対応 JIS

【超塑性材料】(1 規格)

ISO 20032 Method for evaluation of tensile properties of metallic superplastic materials／金属超塑性材料の引張特性の評価方法 (2007 制定, 2013 改正) [H 7501: H14(2002)制定, H28(2016)改正]

【輸送機器用軽量化板材 (高強度アルミニウム合金・高張力鋼)】(2 規格)

ISO 24213 Metallic materials—Sheet and strip—Method for springback evaluation in stretch bending／金属材料—シート及びストリップ—延伸曲げにおけるスプリングバック評価の方法 (2008制定, 2017改正) [H 7702: H15(2003)制定]

ISO 16842 Metallic materials—Sheet and strip—Biaxial tensile testing method using a cruciform test piece／金属材料—シート及びストリップ—十字形試験片を使用する 2 軸引張試験方法 (2014 制定, 2021 改正) [Z 2257: R3(2021)制定]

【金属系超電導材料】(9 規格)

IEC 61788-1 Superconductivity—Part 1: Critical current measurement—DC critical current of Nb-Ti composite superconductors／超電導性—第 1 部: 限界電流計測—Nb-Ti 複合超電導体の直流限界電流 (1998 制定, 2006 改正) [H7301: H9(1997)制定]

IEC 61788-2 Superconductivity—Part 2: Critical current measurement—DC critical current of Nb₃Sn composite superconductors／超電導性—第 2 部: 限界電流計測—Nb₃Sn 複合超電導体の直流限界電流 (1999 制定, 2006 改正) [H7302: H12(2000)制定]

IEC 61788-4 Superconductivity—Part 4: Residual resistance ratio measurement—Residual resistance ratio of Nb-Ti and Nb₃Sn composite superconductors／超電導性—第 4 部: 残留抵抗比計測—Nb-Ti 及び Nb₃Sn 複合超電導体の残留抵抗比 (2001 制定, 2011 改正) [H7306: H17(2005)制定]

IEC 61788-5 Superconductivity—Part 5: Matrix to superconductor volume ratio measurement—Copper to superconductor volume ratio of Cu/Nb-Ti composite superconducting wires／超電導性—第 5 部: 超電導体体積比計測のマトリックス—Cu/Nb-Ti 複合超電導体の銅対超電導体体積比 (2000 制定, 2013 改正)

IEC 61788-6 Superconductivity—Part 6: Mechanical properties measurement—Room temperature tensile test of Cu/Nb-Ti composite superconductors／超電導性—第 6 部: 機械特性計測—Cu/Nb-Ti 複合超電導体の室温引張試験 (2000 制定, 2011 改正)

IEC 61788-8 Superconductivity—Part 8: AC loss measurements—Total AC loss measurement of round superconducting wires exposed to a transverse alternating magnetic field at liquid helium temperature by a pickup coil method／超電導性—第 8 部：交流損失測定—液体ヘリウム温度で横断交流磁界に暴露される円形複合超電導ワイヤのピックアップコイル法による総交流損失測定方法（2003 制定，2010 改正）

IEC 61788-10 Superconductivity—Part 10: Critical temperature measurement—Critical temperature of composite superconductors by a resistance method／超電導—第 10 部：臨界温度の測定—電気抵抗による合成物超電導体の臨界温度（2002 制定，2006 改正）

IEC 61788-11 Superconductivity—Part 11: Residual resistance ratio measurement—Residual resistance ratio of Nb₃Sn composite superconductors／超電導性—第 11 部：残留抵抗比の測定—Nb₃Sn 複合超電導体の残留抵抗比（2003 制定，2011 改正，2016 廃止）

IEC 61788-12 Superconductivity—Part 12: Matrix to superconductor volume ratio measurement—Copper to non-copper volume ratio of Nb₃Sn composite superconducting wires／超電導性—第 12 部：母材対超電導体体積比の測定—Nb₃Sn 合成物超電導線の銅対非銅体積比（2002 制定，2013 改正）[H7308: H18(2006)制定]

【表面化学分析】(21 規格)

ISO 12406 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Method for depth profiling of arsenic in silicon／表面化学分析—二次イオン質量分析法—シリコン内のヒ素の深さ方向分析法（2010 制定）

ISO 13084 Surface chemical analysis—Secondary ion mass spectrometry—Calibration of the mass scale for a time-of-flight secondary ion mass spectrometer／表面化学分析—二次イオン質量分析法—飛行時間型二次イオン質量分析計用の分析計の校正（2011 制定）

ISO 14237 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Determination of boron atomic concentration in silicon using uniformly doped materials／表面化学分析—二次イオン質量分析法—シリコン中に均一に添加されたボロンの原子濃度の定量方法（2000 制定，2010 改正）[K0143: H12(2000)制定]

ISO 14594 Microbeam analysis—Electron probe microanalysis—Guidelines for the determination of experimental parameters for wavelength dispersive spectroscopy／マイクロビーム分析—電子プローブ微量分析—波長分散型分光法の実験パラメタの決定のための指針（2003 制定，2014 改正）

- ISO 14606 Surface chemical analysis—Sputter depth profiling—Optimization using layered systems as reference materials／表面化学分析—スパッター深さ方向分析—層構造系標準物質を用いた最適化法（2000 制定）[K0146: H14(2002)制定]
- ISO 14706 Surface chemical analysis—Determination of surface elemental contamination on silicon wafers by total-reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy／表面化学分析—全反射蛍光 X 線分光法によるシリコンウェハの表面元素汚染の測定法（2000 制定, 2014 改正）[K0148: H17(2005)制定]
- ISO 14707 Surface chemical analysis—Glow discharge optical emission spectrometry (GD-OES)—Introduction to use／表面化学分析—グロー放電発光分光分析法—使用の手引（2000 制定, 2015 改正）[K0144: H13(2001)制定]
- ISO 14975 Surface chemical analysis—Information formats／表面化学分析—情報フォーマット（2000 制定）[K0142: H12(2000)制定]
- ISO/TR 15969 Surface chemical analysis—Depth profiling—Measurement of sputtered depth／表面化学分析—深さ方向分析—スパッター深さ方向の測定方法（2001 制定）
- ISO 16592 Microbeam analysis—Electron probe microanalysis—Guidelines for determining the carbon content of steels using a calibration curve method／マイクロビーム分析—電子プローブマイクロ分析—校正曲線法を用いる鋼の炭素含有量の測定の指針（2006 制定, 2012 改正）
- ISO 16700 Microbeam analysis—Scanning electron microscopy—Guidelines for calibrating image magnification／マイクロビーム分析—電子走査顕微鏡法—映像倍率校正の指針（2004 制定）[K0149-1: H20(2008)制定]
- ISO 17331 Surface chemical analysis—Chemical methods for the collection of elements from the surface of silicon-wafer working reference materials and their determination by total-reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectroscopy／表面化学分析—シリコンウェーハの基礎となる標準物質の表面からの元素の収集のための化学的方法及び全反射蛍光 X 線（TXRF）分光分析法によるその定量（2004 制定）
- ISO 17470 Microbeam analysis—Electron probe microanalysis—Guidelines for qualitative point analysis by wavelength dispersive X-ray spectrometry／マイクロビーム分析—電子プローブ微量分析—波長分散形 X 線分光分析による定性ポイント分析の指針（2004 制定, 2014 改正）

- ISO 17560 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Method for depth profiling of boron in silicon／表面化学分析—二次イオン形質量分析法—シリコン内のホウ素の深度プロファイリングの方法（2002 制定, 2014 改正）
- ISO 18114 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Determination of relative sensitivity factors from ion-implanted reference materials／表面化学的分析—二次イオン質量分析法—イオン注入標準物質からの比感度の測定（2003 制定）
- ISO 18118 Surface chemical analysis—Auger electron spectroscopy and X-ray photoelectron spectroscopy—Guide to the use of experimentally determined relative sensitivity factors for the quantitative analysis of homogeneous materials／表面化学分析—オージェ電子分光法及びX線光電子分光法—同質物質の定量分析のための実験で求めた比感度の使用の手引（2004 制定, 2015 改正）
- ISO 20341 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Method for estimating depth resolution parameters with multiple delta-layer reference materials／表面化学分析—二次イオン質量分析法—複数デルタ層基準材料を用いた深度分解能パラメータの推定方法（2003 制定）
- ISO/TR 22335 Surface chemical analysis—Depth profiling—Measurement of sputtering rate: mesh-replica method using a mechanical stylus profilometer／表面化学分析—深さ分析—スパッタ率の測定：機械筆式側面計を用いるメッシュレプリカ法（2007 制定）
- ISO 22489 Microbeam analysis—Electron probe microanalysis—Quantitative point analysis for bulk specimens using wavelength dispersive X-ray spectroscopy／マイクロビーム分析—電子プローブ微小部分分析法—波長分散形X線分析によるバルク試料の定量的ポイント分析（2006 制定）
- ISO 23812 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Method for depth calibration for silicon using multiple delta-layer reference materials／表面化学分析—二次イオン形質量分析方法—多層膜標準物質を用いるシリコンの深さ方向校正法（2009 制定）
- ISO 23830 Surface chemical analysis—Secondary-ion mass spectrometry—Repeatability and constancy of the relative-intensity scale in static secondary-ion mass spectrometry／表面化学分析—二次イオン質量分析—静的二次イオン質量分析における相対強度スケールの併行精度及び不変性（2008 制定）

【ポーラス金属】(2 規格)

- ISO 13314 Mechanical testing of metals—Ductility testing—Compression test for porous and cellular metals／金属の機械試験—延性試験—多孔質金属及び発泡金属の圧縮試験 (2011 制定) [H7902: H20(2008)制定, H28(2016)改正]
- ISO 17340 Metallic materials—Ductility testing—High speed compression test for porous and cellular metals／金属材料—延性試験—多孔質金属及び発泡金属の高速圧縮試験 (2014 制定, 2020 改正) [H7904: H24(2012)制定]

【ガスタービン用遮熱コーティング】(7 規格)

- ISO 13123 Metallic and other inorganic coatings—Test method of cyclic heating for thermal-barrier coatings under temperature gradient／金属及び無機質皮膜—遮熱コーティングの温度傾斜場における繰返し加熱試験方法 (2011 制定) [H7851: H17(2005)制定, H27(2015)改正]
- ISO 14188 Metallic and other inorganic coatings—Test methods for measuring thermal cycle resistance and thermal shock resistance for thermal barrier coatings／金属及び無機質皮膜—遮熱コーティングの熱サイクル抵抗及び熱衝撃抵抗の測定試験方法 (2012 制定) [H8451: H20(2008)制定, R3(2021)改正]
- ISO 18555 Metallic and other inorganic coatings—Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings／金属及び無機質皮膜—遮熱コーティングの熱伝導率の求め方 (2016 制定) [H8453: H22(2010)制定, H30(2018)改正]
- ISO 19477 Metallic and other inorganic coatings—Measurement of Young's modulus of thermal barrier coatings by beam bending／金属及び無機質皮膜—ビーム曲げによる遮熱コーティングのヤング率の測定 (2016 制定) [H8454: H22(2010)制定, H30(2018)改正]
- ISO 22680 Metallic and other inorganic coatings—Measurement of the linear thermal expansion coefficient of thermal barrier coatings／金属及び無機質皮膜—遮熱コーティングの線熱膨張係数の測定 (2020 制定) [H8455: H22(2010)制定, R4(2022)改正]
- ISO 23486 Metallic and other inorganic coatings—Measurement of Young's modulus of thermal barrier coatings at elevated temperature by flexural resonance method／金属及び無機質皮膜—遮熱コーティングの高温ヤング率の測定 (2021 制定)
- ISO 24449 Metallic and other inorganic coatings—Determination of thermal conductivity of thermal barrier coatings at elevated temperature／金属及び無機質皮膜—遮熱コーティングの高温熱伝導率測定方法 (2021 制定) [H8456: R7(2025)制定]

【磁性材料】(2 規格)

- IEC/TR 63304 Methods of measurement of the magnetic properties of permanent magnet (magnetically hard) materials in an open magnetic circuit using a superconducting magnet／超電導磁石を用いた開磁気回路における永久磁石（硬磁性）材料の磁気特性の測定方法（2021 年制定）[C2500: R4(2022)制定]
- IEC 60404-18 Magnetic materials - Part 18: Permanent magnet (magnetically hard) materials - Methods of measurement of the magnetic properties in an open magnetic circuit using a superconducting magnet／磁気材料－第 18 部：永久磁石（硬磁性）材料－超電導磁石を用いた開磁気回路における磁気特性の測定方法（2025 年制定）